-63-

## УДК 544.236.2

## Цісар О.В., асп.; Піскач Л.В., к.х.н., доц.; Марушко Л.П., к.х.н., доц.; Олексеюк І.Д., д.х.н., проф; Замуруєва О.В., к.ф.-м.н., н.сп.; Парасюк О.В., к.х.н., доц.

# СКЛОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ Tl<sub>2</sub>Se–Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>–GeSe<sub>2</sub>

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, np. Boлi 13, 43025 м. Луцьк, Україна; e-mail: oksana\_tsisar@i.ua

Халькогенідне напівпровідникове скло є технологічно важливими матеріалами, які мають цікаві фізичні властивості, включаючи низьку енергію фононів, значну оптичну нелінійність, велику світлочутливість i високу іонну провідність. Вони широко використовуються в багатьох галузях оптики та електроніки завдяки високій прозорості в ІЧ області спектра [1]. Одним із шляхів розширення застосування та просування у нові області є легування та модифікація матеріалів. Додавання талію в халькогенідні стекла супроводжується помітною зміною їх структурних і фізичних властивостей, які можуть бути потенційно використані, наприклад, в акустооптичних пристроях [2].

В останніх дослідженнях системи  $Tl_2Se-GeSe_2$  [3] було встановлено існування трьох тернарних фаз, які відрізняються характером плавлення:  $Tl_4GeSe_4$  і  $Tl_2GeSe_3$  – утворюються конгруентно при 661 К і 706 К відповідно, а  $Tl_2Ge_2Se_5$  – інконгруентно при 778 К.

Склоутворення в системі Т1-Gе-Se досліджено в працях [4-9]. Область склоподібного стану в цій системі за даними [4] локалізована поблизу бінарної системи Ge-Se. Максимальний вміст талію в складі скла досягає ~ 35% в режимі загартування розплаву на повітрі. В області, що прилягає до сполуки GeSe<sub>2</sub>, яка не утворюється як скло, в застосовуваному режимі загартування отримуються кристалічні сплави. По перерізах GeSe<sub>2</sub>-Tl, GeSe<sub>2</sub>-Tl<sub>2</sub>Se GeSe<sub>2</sub>-TlSe склоподібні сплави одержані лише при вмісті талію більше 22 ат.%. У системі Tl<sub>2</sub>Se-GeSe<sub>2</sub> згідно [5, 6] склоутворення виявлено в інтервалі концентрацій 50-63 мол.% GeSe<sub>2</sub> і за даними [7, 8] до 73 мол.% GeSe<sub>2</sub>. У системі T1<sub>4</sub>GeSe<sub>4</sub>–GeSe<sub>2</sub> в склоподібному стані одержано сплави із вмістом GeSe<sub>2</sub> 55-75 мол.% [9]. Одержані скла стійкі до водних розчинів мінеральних кислот-неокисників, але реагують з розбавленими лугами. Стекла системи T1–Ge–Se показали індуковану тиском кристалізацію, яка має застосування в оптико-електронних приладах [10].

Дані про склоутворення і властивості стекол у системі Ga-Ge-Se описані в роботах Стекла [11-13]. отримували шляхом загартування у льодяну воду від температури 1270 К. Область склоутворення витягнута від бінарної системи Ge-Se вздовж перетину Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>-GeSe<sub>2</sub>. Максимальна кількість галію, що входить до складу скла - 23 ат.%. Авторам [14] при режимі гарту від 1270 К вдалося ввести в склад скла системи Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>-GeSe<sub>2</sub> 28 мол.% Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Германій селенід є ефективним склоутворювачем, що привернув увагу як матриця функціональних мембран для іоноселективної потенціометрії, особливо лля іонів важких металів.

### Експериментальна частина

Для дослідження області склоутворення в системі Tl<sub>2</sub>Se-Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>-GeSe<sub>2</sub> було синтезовано 60 сплавів. Шихта компонувалася із високочистих елементів (не менше 99,99 мас. %). Всі зразки поміщали у кварцеві ампули і відкачували до тиску 1,33·10<sup>-2</sup> Па. Для запобігання розбризкування розплаву в процесі гартування, а також для зменшення втрат на конденсацію парової фази стінками ампул використовували термостатування їх верхньої частини шнуровим азбестом. Після цього проводився нагрів із швидкістю 20-30 К/год до 1300 К. Витримування при максимальній температурі становило 6 годин, після чого ампули із розплавом загартовувалися в холодній воді.

Скловидний стан сплавів контролювався рентгенофазовим (дифрактометр ДРОН-4-13, СиК<sub>а</sub>-випромінювання) та металографічним (мікротвердометр Leica, VMHT Awto, збільшення x3811) аналізами.

Визначення характеристичних температур проводилося диференційно-термічним методом аналізу на дериватографі системи F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey, з використанням Pt/Pt–Rh термопари. Нагрів печі здійснювали зі швидкістю 10 К/хв, охолодження – в інерційному режимі. Оптичні вимірювання проводились за допомогою монохроматора МДР-208 за кімнатної температури 297 К. При цьому виготовлялись плоско-паралельні зразки товщиною ~0.1 мм з відполірованими поверхнями оптичної якості.

На рис. 1. показана встановлена область склоутворення у системі Tl<sub>2</sub>Se–Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>–GeSe<sub>2</sub>. Більшість виготовлених зразків розташовані по шести променях.



Рис. 1. Область склоутворення в квазіпотрійній системі Tl<sub>2</sub>Se-Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>-GeSe<sub>2</sub>.

При вибраному режимі гарту у склоподібному стані на стороні Tl<sub>2</sub>Se-GeSe<sub>2</sub> отримуються сплави i3 максимальним вмістом Tl<sub>2</sub>Se 45 мол. %. Існує вузька неперервна смуга склоутворення від 13 до 33 мол. % Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, яка перетинає весь концентраційний трикутник. По променю із GeSe<sub>2</sub> на сторону Tl<sub>2</sub>Se-Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> (75 мол. % Tl<sub>2</sub>Se) спостерігається розрив області склоутворення. По променю  $GeSe_2$ -TlGaSe<sub>2</sub> в область склоутворення вдалося ввести 10 мол. % Tl<sub>2</sub>Se. По променю із GeSe<sub>2</sub> на сторону Tl<sub>2</sub>Se-Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> (25 мол. % Tl<sub>2</sub>Se) максимальний вміст Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> становить 33 мол. %, що є більше ніж у системі Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>-GeSe<sub>2</sub>. Дифрактограми стекол системи по досліджуваних променях подано на рис. 2.

-65-



**Рис. 2.** Дифрактограми сплавів системи Tl<sub>2</sub>Se–Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>–GeSe<sub>2</sub> загартованих від 1300 К по досліджуваних променях: I – Tl<sub>2</sub>Se–GeSe<sub>2</sub>, II – Tl<sub>2</sub>Se–Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> III – Tl<sub>4</sub>GeSe<sub>4</sub>–"Tl<sub>8</sub>Ga<sub>2</sub>Se<sub>7</sub>", IV – GeSe<sub>2</sub>–"Tl<sub>3</sub>GaSe<sub>3</sub>", V – GeSe<sub>2</sub>–TlGaSe<sub>2</sub>, VI – GeSe<sub>2</sub>–"TlGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>" (склади подано в координатах квазіпотрійної системи).

Для деяких склоподібних сплавів системи встановлено характеристичні температури (температура склування Tg, кристалізації T<sub>c</sub> та плавлення T<sub>m</sub>) і на їх основі розраховано приведені температури склування (Tgr= Tg/Tm) (табл. 1).

<u>№</u> 3	Склад сплаву, мол.%				тν	тν	τV	Eq. oV
$/\Pi$	Tl <sub>2</sub> Se	Ga <sub>2</sub> Se <sub>3</sub>	GeSe <sub>2</sub>	1 g, K	$I_c, \Lambda$	ι <sub>m</sub> , Λ	ι <sub>gr</sub> , Λ	Eg, ev
1	2,5	7,5	90	500	749	959	0.52	1.97
2	5	15	80	497	730	920	0.54	1.95
3	7,5	22,5	70	490	696	913	0.54	1.89
4	10	30	60	483	675	928	0.52	1.93
5	5	5	90	577	719	962	0.60	1.84
6	10	10	80	561	690	976	0.57	1.88
7	23	6	71	491	571	760	0.65	-
8	30	6	64	480	532	754	0.64	-
9	40	3	57	461	532	695	0.66	-
10	26	7	67	495	554	756	0.65	-
11	40	-	60	483	544	751	0.64	-
12	35	-	65	464	530	769	0.60	-
13	30	-	70	473	552	770	0.61	-
14	80	20	-	479	543	988	0.48	-

**Таблиця 1.** Характеристичні параметри скла і ширина енергетичної щілини склоподібних сплавів квазіпотрійної системи Tl<sub>2</sub>Se–Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>–GeSe<sub>2</sub>

-66-

Спектральні залежності коефіцієнтів поглинання α від енергії фотонів hv при кімнатній температурі склоподібних сплавів



**Рис. 3.** Спектральна залежність коефіцієнта поглинання для: sample 1 – 5Tl<sub>2</sub>Se–90GeSe<sub>2</sub>–5Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>; sample 2 – 2,5Tl<sub>2</sub>Se–90GeSe<sub>2</sub>–7,5Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>.

При введенні до GeSe<sub>2</sub> (склоутворювач) сполук Tl<sub>2</sub>Se та Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>  $(2 \le x \le 33)$ (модифікатори) спостерігається зміщення краю поглинання в високоенергетичну область спектра. В області прозорості (в низькоенергетичній області) домішкових максимумів не виявлено.

За даними спектрального розподілу коефіцієнта поглинання в області краю поглинання оцінено ширину енергетичної щілини Eg (за енергією квантів світла для яких α≈550 см<sup>-1</sup>). В табл. 1 подано залежність  $E_{g}$ від складу склоподібних сплавів. Збільшення Е<sub>е</sub> при збільшенні концентрації Tl<sub>2</sub>Se та Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> (модифікаторів), на нашу думку пов'язано з деформацією склоутворюючої матриці при введенні іонів Tl + та Ga<sup>+</sup> які мають більший радіус в порівнянні з [15]. Германієм Наслідком позиційного розупорядкування положення атомів некристалічних матеріалів £ утворення хвостів щільності станів на краю дозволених енергетичних зон, веде що до появи експоненційної залежності коефіцієнта поглинання. Така експоненційна залежність спостерігається  $\alpha(hv)$ зi сторони високоенергетичної ділянки спектра, що свідчить про виконання правила Урбаха,

системи Tl<sub>2</sub>Se–Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>–GeSe<sub>2</sub> по ізоконцентратах 90, 80 мол.% GeSe<sub>2</sub> в представлені на рис. 3, 4.



**Рис. 4.** Спектральна залежність коефіцієнта поглинання для: sample 1 – 10Tl<sub>2</sub>Se–80GeSe<sub>2</sub>–10Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>; sample 2 – 5Tl<sub>2</sub>Se–80GeSe<sub>2</sub>–15Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>.

який описує край смуги власного поглинання невпорядкованих систем [16]. З енергетичної коефіцієнта поглинання залежності та правила Урбаха визначена характеристична енергія ( $\Delta = d(h\nu)/d(\ln \alpha)$ ), що визначає ступінь розмиття краю поглинання. Параметр Δ для всіх досліджуваних зразків лежить в діапазоні 0,10-0,20 eB і узгоджується з даними робіт [17, 18], в яких стверджується, що параметр нахилу урбахівського краю для найрізноманітніших склоподібних систем має значення ∆≈0,05–0,25 еВ. У нашому випадку величина  $\Delta$  залежить від складу склоподібних сплавів. При збільшенні концентрації (модифікаторів) Tl<sub>2</sub>Se та Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> спостерігається збільшення крутизни краю поглинання (зменшення розмиття), що можна інтерпретувати зменшенням величини випадкового потенціального рельєфу для електронів в хвостах щільності станів, які примикають до країв зон.

#### Висновки

Методом рентгенофазового аналізу встановлено область склоутворення у квазіпотрійній системі Tl<sub>2</sub>Se–Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>–GeSe<sub>2</sub>. Для стекол системи визначено характеристичні -67-

температури. Досліджено спектри оптичного поглинання склоподібних сплавів. Встановлено, що оптична ширина забороненої зони змінюється від 1.84 до 1.97 еВ.

#### Список використаних джерел

1. Виноградова Г.З. Стеклообразование и фазовые равновесия в халькогенидных системах. М.: *Наука*, 1984. С. 176.

2. Abdel-Aziz M.M., El-Metwally E.G., Fadel M., Labib H.H., Afifi M.A. Optical properties of amorphous Ge–Se–Tl system films. *Thin Solid Films*. 2001, 386, 99–104.

3. Glukh O.S., Sabov M.Yu., Barchii I.E., Tsigika V.V., Sidei V.I. Formation of ternary compounds in the Tl<sub>2</sub>Se–GeSe<sub>2</sub> system. *Inorg. Mater*. 2009, 45(10), 1092–1096.

4. Борисова З.У. Халькогенидные полупроводниковые стекла. Л.: ЛГУ, 1983. С. 344.

5. Бабанлы М.Б., Кулиева Н.А. Системи T1<sub>2</sub>Se-GeSe<sub>2</sub> и T1Se-GeSe (GeSe<sub>2</sub>). *Журн. неорган. химии.* 1983, 28(6), 1557–1560.

6. Linke D., Giiter M., Krug F. Glasbildung und Phasentrennung in den Systemen Tl–Ge–Se und Pb–Ge–Se. *Z Anorg. Allg. Chem.* 1978, 444(7), 217–236.

7. Михайлов М.Д., Тверьянович А.С. Способность к стеклообразованию в системах As-Те и T1<sub>2</sub>Se-GeSe<sub>2</sub>. *Химия и физика твердого тела*. 1980, 831, 28–34.

8. Туркина Е.Ю., Орлова Г.М. Взаимодействие компонентов и стеклообразование в системе TISe-Tl<sub>4</sub>GeSe<sub>4</sub>-GeSe<sub>2</sub>. *Журн. неорган. химии.* 1983, 28 (8), 2083–2086.

9. Староста В.И. Взаимодействие в системах  $T1_2S(Se)$ -Si(Ge,Sn)S<sub>2</sub>(Se<sub>2</sub>) и получение моно-

кристаллов образующихся сложных халькогенидов: Автореф. дис. ... канд. хим. наук: 02.00.01, УжДУ. Ужгород, 1984.

10. Naik G.M., Parthasarathy G., Gopal E.S.R., Narayanan P.S. Crystallization of bulk TI–Ge–Se glasses under high pressure. *J. Mater. Sci. Lett.* 1985, 4, 1017–1020.

11. Mitkova M.I., Boncheva-Mladenova Z. Glasbildung im system Ge–Se–Ga. C. R. Acad. Bulg. Sci. 1975, 28(2), 189–193.

12. Thiebault C., Guen L., Eholie R. Contribution a l'etude du systeme ternaire Ga–Ge–Se. *Bull. Soc. Chim. France.* 1975, 122(5/6), 967–972.

13. Ollitrault-Fichet R., Eholie R., Rivet J. Etude des verres de chalkogenures. Formers daus le ternaire Ga – Ge – Se. *Ann. Chim. France*. 1977, 2(1), 31–40.

14. Олексеюк І.Д., Парасюк О.В., Божко В.В., Галян В.В., Петрусь І.І. Склоутворення в квазіпотрійних системах Zn(Cd,Hg)Se–Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>–GeSe<sub>2</sub>. *Наукові записки Рівненського пед-інституту*. 1997, 3, 148–152.

15. Саван Я. Исследование кристаллизации стекол в системе Cu – As – Se. *Неорган. материалы.* 1969, 5(3), 492.

16. Parasyuk O.V., Reshak A.H., Klymuk T.L., Mazurets I.I., Zamuruyeva O.V., Myronchuk G.L., Owsik J. Photothermal poling of glass complexes Ag<sub>2</sub>S–Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>–P<sub>2</sub>S<sub>5</sub>. *Opt. Commun.* 2013, 307, 1–4.

17. Клява Я.Г. Правило Урбаха и континуальная неупорядоченность в некристаллических твердых телах. *Физ. тв. тела.* 1985, 27(5), 1350–1353.

18. Вайнштейн И.А., Зацепин А.Ф., Кортов В.С., Щапова Ю.В. Правило Урбаха в стеклах PbO–SiO<sub>2</sub>. Физ. тв. тела. 2000, 42(2), 224–229.

Стаття надійшла до редакції: 18.05.2017.

### GLASS FORMATION IN THE Tl<sub>2</sub>Se-Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>-GeSe<sub>2</sub> SYSTEM

## Tsisar O.V., Piskach L.V., Marushko L.P., Olekseyuk I.D., Zamuruyeva O.V., Parasyuk O.V.

Glass-formation region in the quasi-ternary system  $Tl_2S-Ga_2S_3-GeS_2$  was investigated by quenching molten alloys from 1300 K using X-ray phase analysis method. Glassy alloys with a maximum  $Tl_2Se$  content of 45 mol.% were obtained on the side  $Tl_2Se-GeSe_2$ . A continuous narrow strip of glass formation from 13 to 33 mol.%  $Ga_2Se_3$  crosses the entire concentration triangle. A gap in the glass formation area is observed on the ray from  $GeSe_2$  to the side  $Tl_2Se-Ga_2Se_3$  at 75 mol.%  $Tl_2Se$ . Up to 10 mol.%  $Tl_2Se$  could be introduced into glasses at the  $GeSe_2-TlGaSe_2$  ray. Maximum content of 33 mol.%  $Ga_2Se_3$  was found in the glasses on the ray from  $GeSe_2$  to the side  $Tl_2Se-Ga_2Se_3$ at 25 mol.%  $Tl_2Se$ .Characteristic thermal parameters and optical absorption spectra of the glasses of the system were investigated. The variations of the bandgap energy were determined.